

제18회 테스트 학술대회 일정표

시간	장소	거문고A(3층)	거문고B(3층)	거문고C(3층)	가야금A(2층)	가야금B(2층)	대금(3층)
08:30~09:00		등 록					
09:00~11:10	09:00~10:00 (60분)	Tutorial 1 <u>"Test Strategy Implications on Cost of Test"</u> Randy Kramer(Teradyne) Chair: 유호선(삼성전자)	1-1 Test Industry 박성주(한양대학교)	2-1 Production Test (1) 김영부(윌테크놀로지)	3-1 SoC Design & Test (1) 홍승일(실리콘웍스)	4-1 ATEHardware & Software (1) 전봉완(LG전자)	5-1 Poster 이현빈(한밭대학교)
	10:00~10:10	휴 식					
	10:10~11:10 (60분)	Tutorial 2 <u>"High perf. DRAM Trend 및 Test 요구사항"</u> 김창일(SK하이닉스) Chair : 고진수(TERADYNE)	1-2 Memory Test (1) 남정현(TNS)	2-2 Production Test (2) 권민현(SK하이닉스)	3-2 SoC Design & Test (2) 안진호(호서대학교)	4-2 ATEHardware & Software (2) 엄경운(삼성전자)	5-2 Test Speed Enhancement 윤홍일(연세대학교)
11:20~11:50	개 회 식 사 회 : 이 현 빈 (한밭대학교) / 개 회 사 : 강성호(연세대학교) / 감사패증정 / 우수논문시상						
11:50~12:30	초 청 강 연 강연자 : Gregory Smith (TERADYNE) "Myth vs Reality; Urban Legends of Semiconductor Test"						
12:30~13:30	점 심						
13:30~16:00	13:30~14:30 (60분)	Tutorial 3 <u>"Live Long and Prosper -Power Semiconductor Testing"</u> 김민영(TERADYNE) Chair : 조정호(ADVANTEST)	1-3 Memory Test (2) 조상복(울산대학교)	2-3 Memory Test & Repair (1) 정우식(SK하이닉스)	3-3 SoC Design & Test (3) 유홍범(삼성전자)	4-3 ATEHardware & Software (3) 박제영(삼성전자)	5-3 Design for Reliability (1) 김현진(단국대학교)
	14:30~14:40	휴 식					
	14:40~16:00 (80분)	Tutorial 4 <u>"Image Sensor 테스트 방법과 불량 유형"</u> 윤준호(삼성전자) 박기수(ADVANTEST) Chair : 이중호(용인대학교)	1-4 Memory Test (3) 권 혁(ADVANTEST)	2-4 Memory Test & Repair (2) 김지원(태성에스엔이)	3-4 3D-IC Test 이창원(엑시콘)	4-4 Test Cost Efficiency 전준우(LG전자)	5-4 Design for Reliability (2) 백상현(한양대학교)
16:00~16:20	휴 식						
16:20~17:30	패 널 토 의 좌 장 : 김병호(한양대학교) "장비 시스템, 핸들러, 프로버, 소켓 등의 시장 상황 및 개발 동향"						
17:30~18:00	폐 회 식 폐 회 사 : 이은철(삼성전자)						